

SnAgCu 솔더접합부 금속간화합물의 성장에 대한 고찰

Intermetallic Growth of Solder Joint with SnAgCu

김 영 섭*, 박 재 현*, 이 중 주*, M. Lee**

* 포항산업과학연구원 신뢰성평가센터

** CALCE EPSC, Univ. of Maryland, USA

1. 서 론

Sn에 미량합금원소가 첨가되어 있는 무연솔더는 중고온용 접합에 적합한 소재이다. NCMS (National Center for Manufacturing Science)와 NEMI(National Electronics Manufacturing Initiative)에서는 기존 Sn-Pb 공정계 솔더의 대체소재로 SnAgCu 계를 추천하고 있다. 이 솔더는 적절한 용융온도, 우수한 전단강도와 피로강도, 그리고 Cu 기판에 대한 우수한 젖음성을 가지고 있다. Sn이 풍부하므로 얇은 층의 금속간화합물을 형성하면서 접합하게 된다. 솔더링 동안 초기에 형성된 금속간화합물은 계면에서 우수한 야금학적 결합을 보여주고 있다. 그러나 금속간화합물의 성장은 접합강도에 영향을 미치고 그 결과 접합부의 파단을 유발하여 접합부 신뢰성에 큰 영향을 미친다. Sn-Pb 솔더 접합부에는 Sn-Cu 금속간화합물이 성장한다고 보고가 되고 있는데, 높은 Sn 함량으로 더욱 그러한 경향을 보여주고 있다.

본 연구에서는 Sn-Pb 대체 조성 중에서 Sn₃.0Ag0.5Cu 솔더와 기판 사이의 반응결과에 대하여 고찰 할 것이다. 접합계면 미세조직 분석에 의한 금속간화합물의 조성을 파악하고 그 성장속도를 비교하며, 전단강도 및 경도 측정으로 도금의 영향을 비교하게 된다.

2. 시험방법

2.1 시편준비

본 연구에서 사용한 기판(FR-4)은 두 종류의 도금 OSP(Organic Solderability Preservative)와 Au/Ni(Immersion Au over Electroless Ni)를 각각 적용하였다. 기판 제작을 위한 솔더링조건(Reflow Profile)은 표 1과 같다.

2.2 시효조건

솔더링 후 기판은 143.5°C(0.85T_m)에서 100시간과 1000시간 동안 유지하였다. 0.85 T_m은 금속간화합물 성장이 시작되는데 필요한 최소 온도로 알려져 있다.

3. 결과 및 고찰

3.1 미세조직

3.1.1 Au/Ni도금

Figure 1은 1000시간 시효 후 솔더와 Au/Ni 도금 계면의 단면조직을 보여주고 있다. 접합계면의 금속간화합물은 EDX 분석결과 Cu-Ni-Sn조성으로 2~3μm두께의 Ni층에 7~8μm두께로 성장한 것으로 나타났다. 이 금속간화합물은 솔더 후 거의 무시할 정도였으나 100시간 시효 후 2~3μm로 성장하여 1000시간 후에는 8μm까지 성장하였다.

3.1.2 OSP도금

Figure 2는 1000시간 시효 후 OSP 처리한 기판에서 솔더 계면의 단면조직을 보여주고 있다.

금속간화합물은 조성이 다른 두개의 층으로 구분되어 나타나고 있다. 접합계면에는 일반적으로 Sn dendrite와 Ag_3Sn 의 분산상을 관찰할 수 있으며 솔더 내에는 Cu_6Sn_5 가 나타나고 있다.

Figure 3은 Au/Ni 도금에서는 Cu-Ni-Sn 조성의 금속간화합물이, OSP 도금에서는 Cu-Sn 조성의 금속간화합물이 시효시간에 따라서 성장하는 것을 도표로 나타내고 있다. 시효시간($\text{Hr}^{1/2}$)에 따라서 금속간화합물이 직선적으로 변하는 것으로 부터 계면의 금속간화합물 성장은 확산이 지배하는 반응임을 알 수가 있다.

3.2 기계적 특성

3.2.1 전단강도

두 가지 도금 Au/Ni와 OSP 사이에는 전단강도가 다르게 나타나고 있다. Au/Ni 도금의 경우 1000시간 시효 후 전단강도는 32.29MPa에서 26.59MPa로 감소(18.7% 감소)하였으며, 강도의 큰 변화는 주로 시효 100시간 이전에 나타나고 있다. 실제 100시간 이후 1000시간이 지나도 강도 값은 27.66MPa에서 26.59MPa로 크게 변화가 없는 것을 알 수 있다. 그러나 OSP 도금의 경우 전단강도가 31.97MPa에서 17.5MPa로 45.3%의 감소를 보여주고 있다.

3.1.2 경도

금속간화합물의 경도 측정을 위하여 0.2gr 하중의 나노경도시험을 실시하였다. Figure 4.는 Au/Ni도금에서 성장한 Cu-Ni-Sn층과 OSP에서 성장한 Cu-Sn층의 경도를 비교하여 보여주고 있다. Au/Ni 도금층에서 성장한 금속간화합물이 경도가 높은 것으로 나타났다.

4. 결 론

SnAgCu 솔더와 서로 다른 도금 사이 금속간화합물은 각각 다른 조성으로 Au/Ni 도금은 Cu-Ni-Sn층이 OSP 도금은 Cu-Sn 층이 형성된 것을 볼 수 있었으며, OSP

도금에서 Cu-Sn 층이 빠르게 성장하였다. Au/Ni 도금의 경우 솔더의 젖음성과 전단강도가 우수하지만 경도가 높아서 시효균열의 가능성을 배제할 수 없다.

후 기

본 연구는 산업자원부지원 신뢰성평가 기반구축사업 중 RIST와 미국 메릴랜드대학교 CALCE, EPSC의 국제협력에 의하여 추진한 내용입니다.

참고문헌

- I. Chatterji, D. Santos, and F. Andros, Proceeding of NEPCON West – Fiberoptic Expo, 2002, pp. 277–287.
- R. Fields and S. Low, Research Publication of Material Performance Group, NIST, Feb. 2002.
- T. Uno and K. Tatsumi, J. Japan Inst. Metals, Vol. 63, No.3, 1999, pp. 406–415.
- Edwin Bradley, Pradeep Lall, and Kingshuk Banerji, Proceedings of SMTA, Sept. 1996, pp. 95–106.
- R. Kisiel and J. Kalenik, Proceedings of IMAPS Poland Conference 2000.
- Z. Mei, M. Kaufmann, A. Eslambolchi, and P. Johnson, Proceedings of ECTC 1998, pp. 952–961.
- Y. Zheng, C. Hillman, P. McCluskey, Proceedings of ECTC 2002.

Table 1. Reflow Profile Summary

	Actual Parameter
Heating Rate	1~2°C/sec
Peak Temperature	242°C
Liquidus Time	55sec
Cooling Rate	2°C/sec

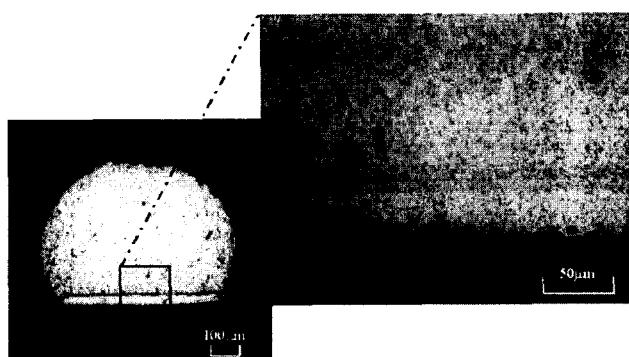


Figure 1.. Cross Section of Solder after 1000 Hour Aging with Au/Ni Plating and SnAgCu Solder

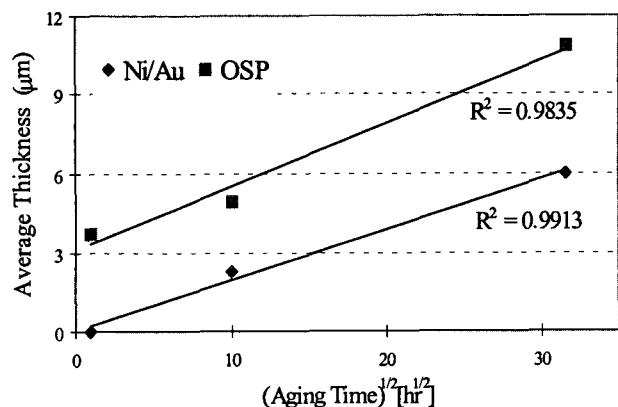


Figure 3. . The Average Thickness of Intermetallic Compound Layers (Cu-Sn Phase in OSP and Cu-Ni-Sn Phase in Au/Ni Plating with SnAgCu Solder) Against Aging Time^{1/2}

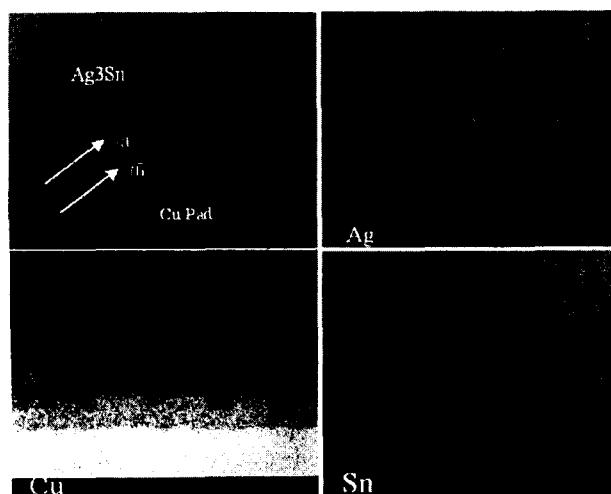


Figure 2 . Overall Distribution of Silver, Tin, and Copper in Cross-section of SnAgCu Solder and PWB with OSP after 1000hr Aging (Result of EDX Compositional Mapping)

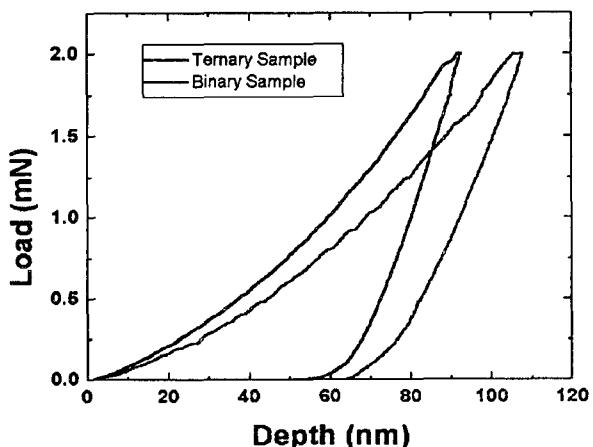


Figure 4. Nanoindentation Data as Load Versus Displacement Curves for Cu-Sn and Cu-Ni-Sn